

УДК 535.343+375 : 539.3

## ДЛИННОВОЛНОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ФОНОНЫ КРИСТАЛЛА МЕТАВАНАДАТА НАТРИЯ

А. Э. Числер, А. Н. Лазарев

Исследованы с применением поляризованного излучения ИК спектры отражения и спектры КР кристалла  $\text{NaVO}_3$ , в котором предполагается возможность существования связей V—V между атомами ванадия в высшей степени окисления. Проведена практически полная идентификация длинноволновых оптических фононов. Для полярных фононов определены квадраты амплитуд дипольных моментов, направленных вдоль двойной оси, а для моментов, нормальных к ней, установлена также ориентация относительно кристаллографических осей, не фиксируемая условиями симметрии.

Интерес к химическому аспекту высокотемпературной сверхпроводимости стимулирует внимание к особенностям связывания  $d$ -элементов в кристаллических оксидах. Применительно к ванадию, для низших степеней окисления которого образование связей V—V, существенно влияющих на строение и физические свойства [1], установлено довольно давно, вопрос о возможности осуществления подобных связей в состоянии  $\text{VV}$  остается открытым. На основании предварительных результатов анализа особенностей колебательного спектра метаванадата натрия  $\text{NaVO}_3$  с тетраэдрической координацией V по кислороду нами было высказано предположение о возможности связывания V—V несмотря на достигающие 3.4 Å расстояния между этими атомами [2]. Результаты полуэмпирического ССП МО ЛКАО расчета электронного строения модельной системы (циклического оксианиона  $\text{V}_3\text{O}_9^{3-}$  из трех ванадийкислородных тетраэдров) не противоречили этому предположению.

Ниже представлены более полные данные по фононному спектру  $\text{NaVO}_3$ , полученные при исследовании монокристалла и практически исчерпывающие проблему идентификации длинноволновых оптических фононов этого кристалла, необходимой для последующих попыток построения его динамической модели в форме, отражающей специфику межатомных взаимодействий. Моноклинный ( $C2/c - C_{2h}^6$ ) кристалл метаванадата натрия содержит в примитивной ячейке элементарные отрезки двух трансляционно-неэквивалентных цепей  $[\text{V}_2\text{O}_6]_\infty$ , образованных конденсацией ванадийкислородных тетраэдров посредством общих вершин, и четыре катиона  $\text{Na}^+$  [3]. Представление длинноволновых оптических колебаний имеет структуру

$$\Gamma_{k=0}^{\text{opt}} = 14(10) A_g + 13(10) A_u + 16(10) B_g + 14(10) B_u,$$

где в скобках указано число колебаний, соответствующих внутренним степеням свободы метаванадатных цепей. Ввиду центросимметричности кристалла правила отбора в ИК спектрах и спектрах КР подчинены альтернативному запрету. При этом, поскольку операция инверсии преобразует одну метаванадатную цепь в другую, одна из компонент давыдовского дублета, соответствующего каждому из внутренних колебаний цепи, активна в ИК спектре, а другая — в спектре КР.

ИК спектры отражения измерены в интервале 1100—85 см<sup>-1</sup> на спектрометрах СПЕКОРД М80 и длинноволновом вакуумном приборе лабора-

торного изготовления с помощью осветительной системы конструкции В. Ф. Павинича. Спектры измеряли при близком к нормальному падении, используя в качестве поляризатора металлизированную реплику 1200 штр./мм на полиэтиленовой пленке (плоскость поляризации во всех случаях была нормальна плоскости падения). Несовершенство поверхности кристалла учитывали, сравнивая отражение от нее с последующими измерениями отражения от той же поверхности с напыленным слоем алюминия. Поверхности кристалла полировали в безводных условиях кроку-

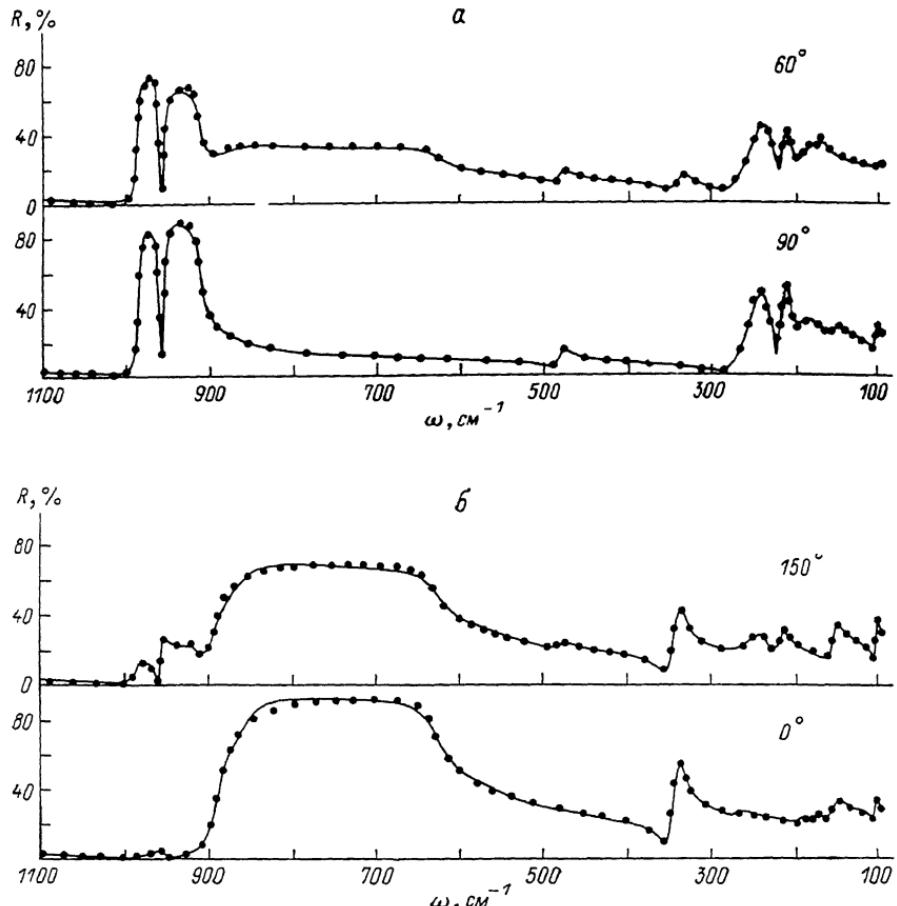


Рис. 1. Спектры отражения от плоскости *ac* и их воспроизведение по результатам Д.А.  
Значения углов  $\varphi$  между электрическим вектором  $E$  и осью с указаны на кривых.

сом на ватмане. Отсутствие заметного влияния нарушенного поверхностного слоя кристалла на определяемые из спектров параметры установлено путем сравнения с параметрами, определенными по спектрам отражения от поверхностей, обработанных другими способами.

Для кристаллов моноклинной сингонии ориентации дипольных моментов фононов из представления  $B_u$  в плоскости, перпендикулярной к оси второго порядка, не определяются соображениями симметрии и непосредственно отражают формы соответствующих нормальных координат и величины динамических зарядов в системе. Методика, позволяющая установить по наблюдаемым спектрам не только частоты и квадраты амплитуд дипольного момента, но и ориентацию последнего относительно кристаллографических осей, образующих плоскость угла моноклинности, разработана Белоусовым и Павиничем [4, 5]. Она предусматривает совместную обработку нескольких спектров отражения, полученных при различной ориентации электрического вектора  $E$  падающего излучения относительно осей моноклинного угла, с помощью модифицированного варианта клас-

сического дисперсионного анализа (ДА) для совокупности компланарных, но не параллельных осцилляторов Лоренца.

Серия спектров отражения от поверхности кристалла метаванадата натрия, параллельной плоскости  $ac$ , была зарегистрирована при изменяющемся с шагом в  $30^\circ$  угле  $\varphi$  между  $E$  и  $c$ , отсчитываемом от оси  $c$  в сторону тупого угла между  $c$  и  $a$ . Для определения параметров фононных осцилляторов методом ДА подвергнуты совместной обработке две пары спектров, полученных при взаимно ортогональных ориентациях  $E$ : при  $\varphi = 0^\circ, 90^\circ$  и  $60^\circ, 150^\circ$ . Эти спектры представлены на рис. 1, где точками показаны спектры, восстановленные расчетным путем по параметрам осцилляторов, полученным в результате ДА. Процедура оптимизации совпадения расчетных спектров с наблюдаемыми путем вариации параметров осцилляторов включала также поиск оптимальных значений параметров эллипсоида высокочастотной диэлектрической проницаемости: главных значений

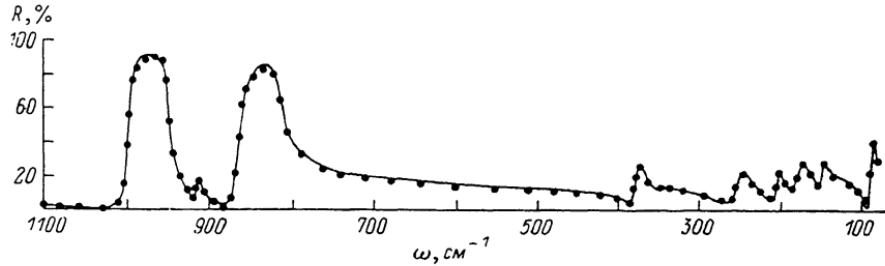


Рис. 2. Спектр отражения при  $E \parallel b$  от плоскости, параллельной двойной оси.

$\epsilon_{33}^{\infty}$ ,  $\epsilon_{11}^{\infty}$  и угла  $\beta$ , определяющего направление  $\epsilon_{33}^{\infty}$  относительно оси  $c$  и отсчитываемого в том же направлении, что и  $\varphi$  (ориентация третьей оси эллипсоида фиксируется условиями симметрии, а величина  $\epsilon_{33}^{\infty}$  оптимизируется при ДА спектра осцилляторов из представления  $A_u$ ). В табл. 1 приведены частоты поперечных  $\omega_t$  и продольных  $\omega_l$  колебаний, затухания  $\gamma$  и углы  $\varphi_t$ , характеризующие ориентации фононных осцилляторов из представления  $B_u$ . Силы осцилляторов  $S_t$  вычислены в приближении малых затуханий [4, 5]. Один из ожидаемых 14 осцилляторов в данном представлении остается неидентифицированным, вероятно, вследствие малой полярности соответствующего колебания.

Спектр отражения от плоскости, параллельной оси  $b$ , который соответствует при  $E \parallel b$  осцилляторам из представления  $A_u$ , приведен на рис. 2

Таблица 1

Параметры фононных осцилляторов типа  $B_u$

$\omega_t, \text{ см}^{-1}$	$\omega_l, \text{ см}^{-1}$	$\gamma, \text{ см}^{-1}$	$\varphi_t, \text{ град}$	$S_t \cdot 10^{-5}, \text{ см}^{-2}$
960.4	986.7	2.0	72.3	0.20
914.3	955.7	4.1	90.0	3.52
635.1	888.1	15.7	2.1	13.94
478.1	483.6	13.5	99.5	0.17
333.9	349.7	11.0	178.4	0.91
266.9	279.9	39.6	55.0	0.09
235.6	257.2	13.8	85.9	0.26
211.0	221.3	7.2	101.0	0.21
195.8	201.7	19.8	93.2	0.16
185.5	191.2	19.1	55.0	0.23
173.7	175.5	8.0	49.0	0.09
149.8	158.7	15.1	140.7	0.21
99.6	102.4	3.8	134.4	0.05

Таблица 2

Параметры фононных осцилляторов типа  $A_u$

$\omega_t, \text{ см}^{-1}$	$\omega_l, \text{ см}^{-1}$	$\gamma, \text{ см}^{-1}$	$S_t \cdot 10^{-5}, \text{ см}^{-2}$
950.1	998.2	2.7	1.69
913.2	315.8	5.8	0.17
814.7	868.8	8.0	4.05
580*	—	—	—
374.3	381.5	9.0	0.20
342.3	342.6	6.0	0.01
246.5	255.7	14.9	0.16
200.6	205.6	8.6	0.07
173.8	181.7	13.8	0.15
147.2	149.5	6.0	0.05
86.0	91.0	4.7	0.05

Примечание. Оценка по частоте поглощения  $\text{LiVO}_3 \star \epsilon_{33}^{\infty} = 3.20$ .

Примечание.  $\epsilon_{11}^{\infty} = 3.05$ ,  $\epsilon_{33}^{\infty} = 3.78$ ,  $\beta = 4.8^\circ$ .

вместе со спектром, восстановленным по параметрам, полученным в результате ДА (точки). Методика ДА спектра, образованного совокупностью параллельных осцилляторов, известна и не нуждается в дополнительных пояснениях. Параметры осцилляторов указаны в табл. 2, из которой следует, что в спектре отражения удалось обнаружить лишь 10 из ожидаемых 13 колебаний в представлении  $A_u$ . Изготовление срезов монокристалла, достаточно тонких для обнаружения недостающих слабых осцилляторов в поглощении, оказалось затруднительным. Наблюдению этих осцилляторов в спектре поглощения поликристаллического образца препятствует суперпозиция интенсивных полос колебаний  $A_u$  и  $B_g$ , охватывающих широкие участки спектра. Только одно из недостающих колебаний в представлении  $A_u$ , соответствующее внутренней деформации валентного типа в метаванадатной цепи, удается идентифицировать достаточно надежно с помощью излагаемых ниже соображений.

В области частот выше  $300 \text{ см}^{-1}$  практически отсутствует смешивание внутренних степеней свободы метаванадатной цепи со степенями свободы решетки, а величины давыдовских расщеплений внутренних колебаний ( $A_g - B_g$ ,  $A_u - B_g$ ) не превышают немногих десятков  $\text{cm}^{-1}$ , как можно заключить из сравнения ИК спектров со спектрами КР. Поэтому из наблюдения в КР вблизи  $550 \text{ см}^{-1}$  полосы колебания  $B_g$  с необходимостью следует присутствие в окрестности данной частоты колебания  $A_u$ , т. е. второй компоненты дублета (согласно приближенному расчету, в [2] этот дублет отвечает колебанию  $v_{\text{VOV}}$  симметрии  $A''$  в цепи с одномерной фактор-группой, изоморфной  $C_s$ ). ИК спектр поликристаллического образца  $\text{NaVO}_3$  в этой области частот, свободной от сильных полос отражения, обнаруживает признаки очень слабого поглощения, несколько усиливающиеся в спектре изоструктурного  $\text{LiVO}_3$ . Определенная по спектру последнего частота максимума поглощения около  $580 \text{ см}^{-1}$  может быть принята в качестве удовлетворительной оценки частоты соответствующего колебания в  $\text{NaVO}_3$ .

Спектры КР измерены при наблюдении  $90^\circ$ -го рассеяния с помощью спектрометра ДФС-24. Возбуждение от линии 488 нм  $\text{Ar}^+$ -лазера ILA-120 с мощностью около 800 мВт. В декартовой системе координат, связанной с кристаллом и используемой для определения геометрических параметров эксперимента, ось  $y \parallel b$ , т. е. двойной оси, совпадающей по требованиям симметрии с одной из главных осей эллипсоида, показателя преломления. Направления двух других главных осей эллипсоида, не определяемые симметрией кристалла, находили, наблюдая погасания в скрещенных николях (в белом свете) на поляризационном микроскопе. Угол между осью  $z$  и кристаллографической осью  $c$  составил  $\sim 4^\circ$  в хорошем согласии с определением ориентации осей высокочастотной диэлектрической проницаемости при ДА спектров ИК отражения.

Тензор производных поляризуемости кристалла имеет следующий вид

$$\begin{bmatrix} A_g \\ \alpha'_{xx} & 0 & \alpha'_{xz} \\ 0 & \alpha'_{yy} & 0 \\ \alpha'_{xz} & 0 & \alpha'_{zz} \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} B_g \\ 0 & \alpha'_{xy} & 0 \\ \alpha'_{xy} & 0 & \alpha'_{yz} \\ 0 & \alpha'_{yz} & 0 \end{bmatrix}.$$

Спектры наблюдали при различных установках образца, одна из которых позволяла проводить измерения при геометриях  $z(xy)x$ ,  $z(xz)x$ ,  $z(yy)x$  и  $z(yz)x$ , а другие — при  $y(zz)x$  и  $z(xx)y$ . Несмотря на условия возбуждения и регистрации рассеянного света, обеспечивающие при указанных ориентациях поляризатора и анализатора выделение рассеяния, связанного с одной из компонент тензора, в наблюдаемых спектрах присутствовали и полосы, соответствующие другим компонентам. Это связано со значительным двулучепреломлением ( $n_g = 2.04$  и  $n_g = 1.77$  по измерениям в белом свете) и, возможно, дисперсией осей эллипсоида показателей преломления (в плоскости  $ac$ ), на которую указывают изменения цветности

кристалла вблизи положений погасания при наблюдениях в скрещенных николях на поляризационном микроскопе.

Для понижения относительной интенсивности полос, запрещенных при данной геометрии, увеличивали до 230 мм фокусное расстояние линзы в возбуждающем пучке и уменьшали щелевой диафрагмой апертуру сбора рассеянного излучения до 1/20. В области частот ниже 400 см<sup>-1</sup> измерения проведены также при температуре около 90 К, достигаемой обдуванием кристалла парами азота, с целью уменьшения ширин полос, затрудняющих достоверное разрешение сложной структуры спектра в интервале 270—220 см<sup>-1</sup>. Эти меры позволили, в частности, убедиться в присутствии почти совпадающих полос в представлениях  $A_g$  и  $B_g$  (252.4 см<sup>-1</sup> в  $A_g$  и 251.8 в  $B_g$  или 261.1 в  $A_g$  и 260.3 в  $B_g$ ), разности частот которых лежат в пределах абсолютной погрешности измерений ( $\sim 1$  см<sup>-1</sup>).

Таблица 3

Частоты колебаний типов  $A_g$  и  $B_g$  и компоненты тензора производных поляризуемости, определяющие их интенсивности в КР

$A_g$		$B_g$		$A_g$		$B_g$	
$\omega$	$\alpha'_{ij}$	$\omega$	$\alpha'_{ij}$	$\omega$	$\alpha'_{ij}$	$\omega$	$\alpha'_{ij}$
960.9	$xx, yy$	946.3	$xy$	231.7	$yy$	251.8	$yz$
924.8	$xx, yy, zz$	913.1	$xy$	189.7	$zz$	239.2	$xy$
645.6	$zz, xx$	844.7	$xy$	127.4	$xx, zz$	227.2	$yz$
514.4	$xx, zz$	552.5	$yz$	110.2	$zz$	176.6	$yz$
382.0	$zz$	384.3	$xy$	95.6	$yy, zz$	157.2	$yz$
365.5	$zz$	348.5	$yz$	75.9	$zz$	99.5	$xy, yz$
261.1	$yy, xx$	321.7	$xy, yz$	—	—	67.4	$xy, yz$
252.4	$yy$	260.3	$yz$				

Частоты полос в спектрах КР указаны в табл. 3, содержащей также сведения о компонентах тензора производных поляризуемости, дающих основной вклад в интенсивность данной полосы. Из этой таблицы следует, что идентифицированы все 14 колебаний кристалла в представлении  $A_g$  и 15 из ожидаемых 16 колебаний в представлении  $B_g$ . Вместе с представленными выше материалами обработки ИК спектров эти данные позволяют предпринять попытку построения динамической модели кристалла, отражающей специфику межатомных взаимодействий и контролируемой расчетом колебательного спектра. Результаты вычислений предполагается рассмотреть в последующем сообщении.

#### Литература

- [1] Бугаев А. А., Захарченя Б. П., Чудновский Ф. А. Фазовый переход металл—полупроводник и его применение. Л.: Наука, 1979. 183 с.
- [2] Лазарев А. Н., Числер А. Э., Щеголев Б. Ф., Миргородский А. П. Хим. физика, 1982, № 9, с. 1170—1178.
- [3] Marumo F., Isobe M., Iwai S. Acta Cryst. B, 1974, vol. 30, N 5—6, p. 1628—1630.
- [4] Белоусов М. В., Павинич В. Ф. Опт. и спектроск., 1978, т. 45, № 5, с. 920—926.
- [5] Павинич В. Ф., Белоусов М. В. Опт. и спектроск., 1978, т. 45, № 6, с. 1114—1118.

Институт химии силикатов  
им. И. В. Гребенщикова АН СССР  
Ленинград

Поступило в Редакцию  
18 января 1988 г.